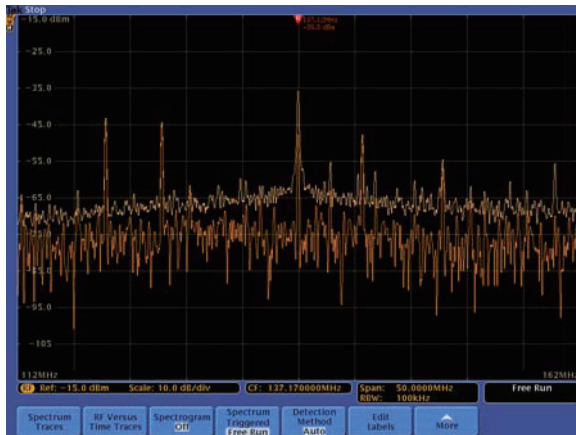


调试EMI问题

您的挑战：

EMC测试的成本非常高。多次造访测试机构可能会给您的项目增加大量的成本和延迟，而您又买不起测试机构使用的工具和设置。

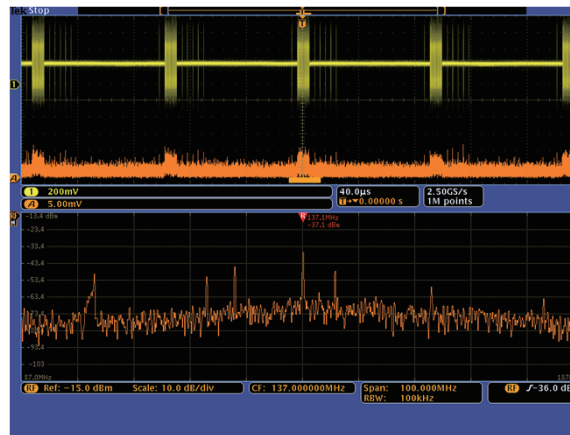
在寻找EMI问题的位置和来源时，您可能会损失宝贵的时间和机会。一个通常的惯例是使用近场探头和频谱分析仪，确定EMI报告中发现的辐射来源。有了传统频谱分析仪，您现在可以让仪器来完成调试工作，您自己则负责查找示意图中的EMI来源。



使用MDO4000系列的频谱分析仪，迅速查看频谱辐射。

泰克优势：

MDO4000提供了多种功能，使您能够迅速调试EMI问题。许多EMI问题来自植根于时域的事件，如时钟、电源和串行数据链路。MDO4000在一台仪器中融合了频谱分析仪功能、示波器功能和逻辑通道，使您能够测量时域事件和频谱辐射之间的关系。



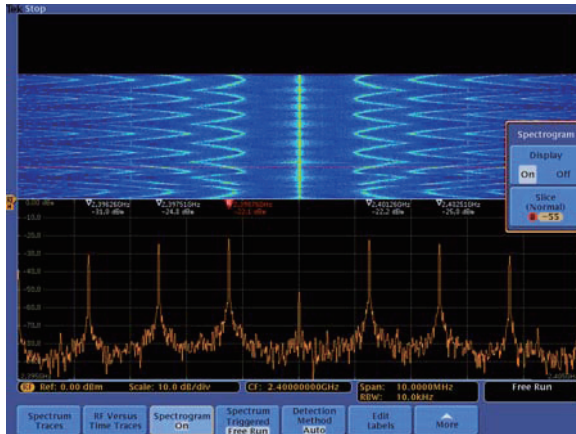
触发已知EMI问题的疑似来源(如电源、时钟、串行总线)，直接测量及关联频域事件和时域事件。

泰克解决方案的独特优势：

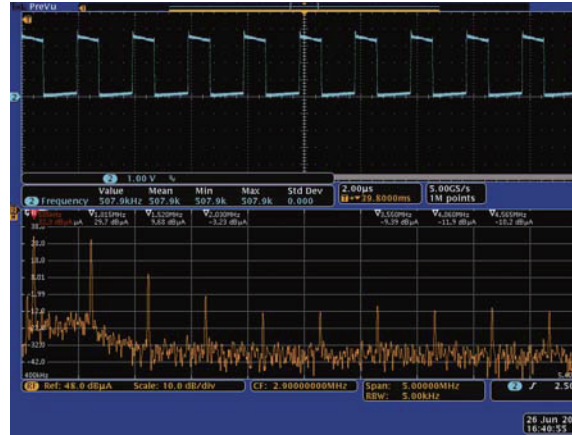
- MDO4000是在一个紧凑的包装中同时提供了频谱分析仪功能、示波器功能和逻辑分析仪功能的仪器。
- 与类似性能的单机版频谱分析仪相比，入门级MDO4000的价格更低，提供的测量功能更多。
- MDO4000为验证设计提供了一种经济的解决方案，而不需要多次往返EMI测试机构。
- MDO4000可以简便地把电源信号、串行数据信号和RF信号同时关联起来。
- 多域相关意味着MDO4000可以协助确定EMI问题的根本原因。
- 泰克提供了多种探头，可以满足MDO4000模拟输入和频谱分析仪输入的电压测量和电流测量需求。

调试EMI问题

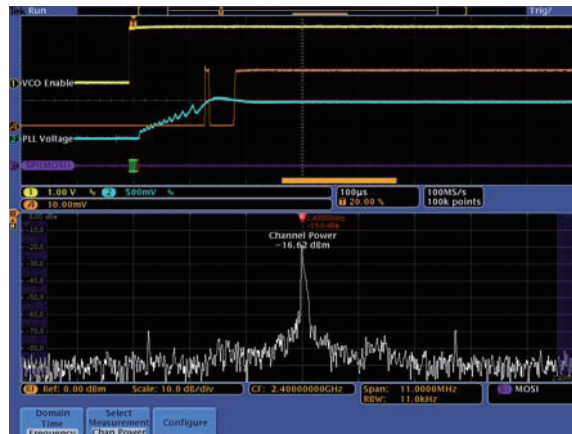
您第一次可以捕获时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号，在系统级全面了解器件特点。您可以一目了然地同时查看时域和频域。您可以在任何时点上观察RF频谱，查看其怎样随时间或器件状态变化。您可以使用与您的设计一样高度集成的仪器，迅速高效地解决最复杂的设计问题。



频谱图是看到的频谱中的相对幅度随时间变化的视图。频谱图画面提供了直观的彩色地图，显示了信号怎样随时间变化。您甚至可以返回并比较以前采集的数据。



在测量EMI的同时，观察开关晶体管的控制电压。



监测模拟事件、数字事件和RF事件之间的系统级交互。迅速定位EMI的潜在来源。

2/2013 © Copyright Tektronix 48C-28873-0

更多信息

产品技术资料:

- MDO4000系列

视频:

- MDO4000系列虚拟教程
- 高级RF触发和跨域触发
- 全面分析宽带系统
- MDO4000频谱分析仪与示波器FFT比较
- 寻找无线嵌入式设计中的噪声来源
- 调试WLAN功放
- www.youtube.be/user/w2aew
- 还有更多: www.tek.com/mdo4000

资料:

- MDO4000系列基础知识(应用指南)
- 揭秘MDO4000频谱分析仪动态范围(应用指南)
- 调试EMI问题: 峰值还是非峰值(白皮书)
- 调试常见的EMI问题(白皮书)
- 低压测量(如纹波)的探测考虑因素(应用指南)
- MDO4000系列与传统示波器FFT比较(速查资料)
- 查找无线嵌入式系统中的噪声来源(应用指南)
- 还有更多: www.tek.com/mdo4000

了解更多信息: www.tek.com/mdo4000